

STAR-CMC-1550 光纤模式测量分析仪

STAR-CMC-1550 光纤模式测量分析仪使用空间和光谱分辨成像 (S2) 技术来识别少模光纤的传播模式。它由两个不同的单元组成：一个可调谐激光器和一个接收器单元。STAR-CMC-1550 允许获得每种传播模式的差分群延迟 (DGD) 以及与最激发模式相比的相对强度或多径干扰 (MPI)。此外，STAR-CMC-1550 允许重建被测光纤的导模轮廓和相位。

特点与优势：

- 可测量直径高达 400 μm 的光纤
- 可测量空芯和实芯少模光纤
- 可重建传播模式剖面 and 相位
- 可计算高阶模式与最激发模式相比的相对强度
- 可计算传播模式的 DGD

技术规格：

测量能力

- 纤维直径：< 400 μm
- 光纤长度：5~100m
- 测量时间**：< 90 秒
- 光纤类型：少模实芯和空芯光纤
- 可分析 2000 张图像

光学参数

- 测量波长：1480~1630 nm
- 波长分辨率：10 pm
- 最大 DGD：365 ps
- DGD 分辨率：0.05 ps
- 图像传感器：InGaAs 10.8x12.3 mm, 512x640 像素, 20 μm 像素间距
- 曝光范围：0.1ms 至 20ms 曝光时间
- A/D 转换：16 位

物理参数

- 重量：7kg (可调谐激光)； 8kg (接收单元)
- 尺寸：0.22m x 0.385m x 0.131m (可调谐激光器)； 0.306m x 0.606m x 0.145m (接收器单元)
- 工作温度：15-300 $^{\circ}\text{C}$
- 湿度：相对湿度 5%-95%，非冷凝
- 计算机要求：所有系统均配备运行最新 Windows 操作系统的计算机
- 数据接口：1 X USB 3.0 (USBA to USBB: 提供 1m 电缆)



STAR-nPA-400 光纤折射率分析仪



在几秒钟内即可测量光纤折射率！

STAR-nPA-400 是获取用于验证标准和特种光纤所需的折射率数据的快速、简单且低成本的方法。

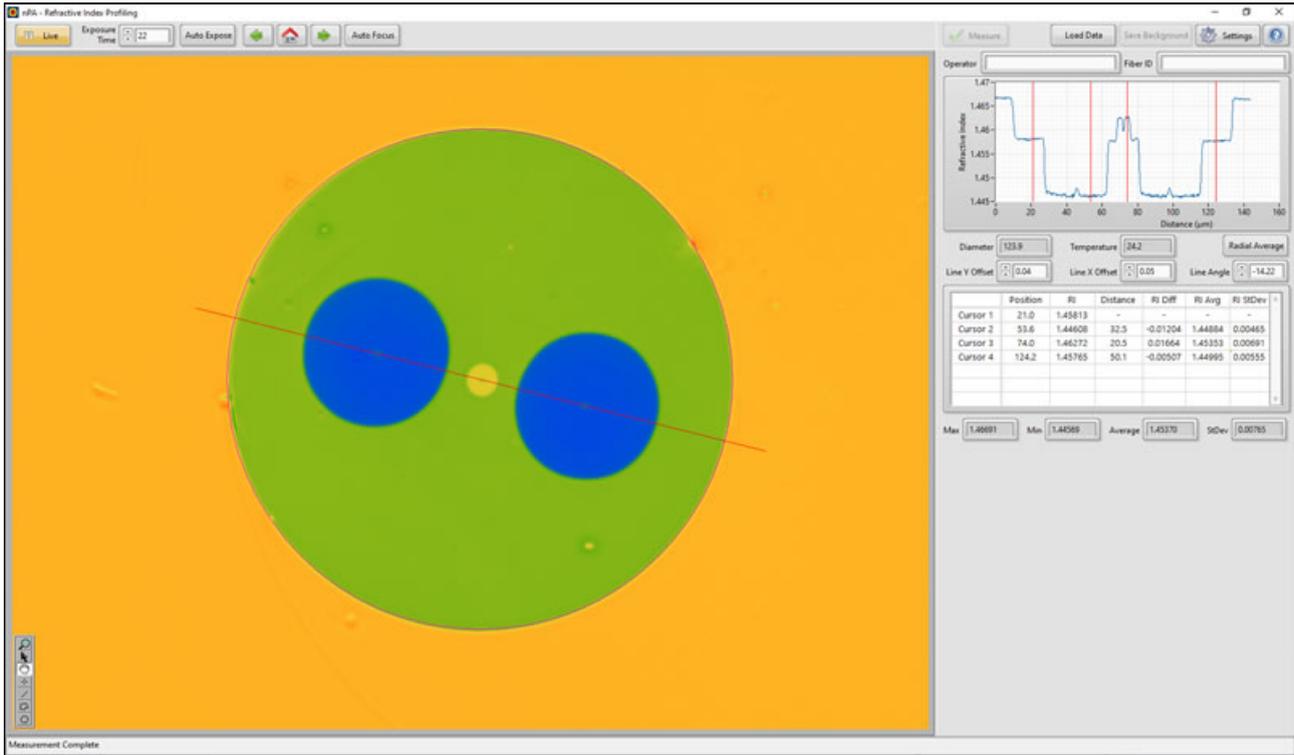
最少化需要的光纤准备工作，同时干净、高效的图形用户界面允许用户以最少的培训或经验充分表征他们的光纤。STAR-nPA-400 提供准确且可重复的折射率数据，提供有关光纤设计和制造过程的宝贵信息。

STAR-nPA-400 折射率分析仪使用改进的折射近场技术来分析光纤的端视图灰度强度分布，以确定其完整的 2D 折射率分布。

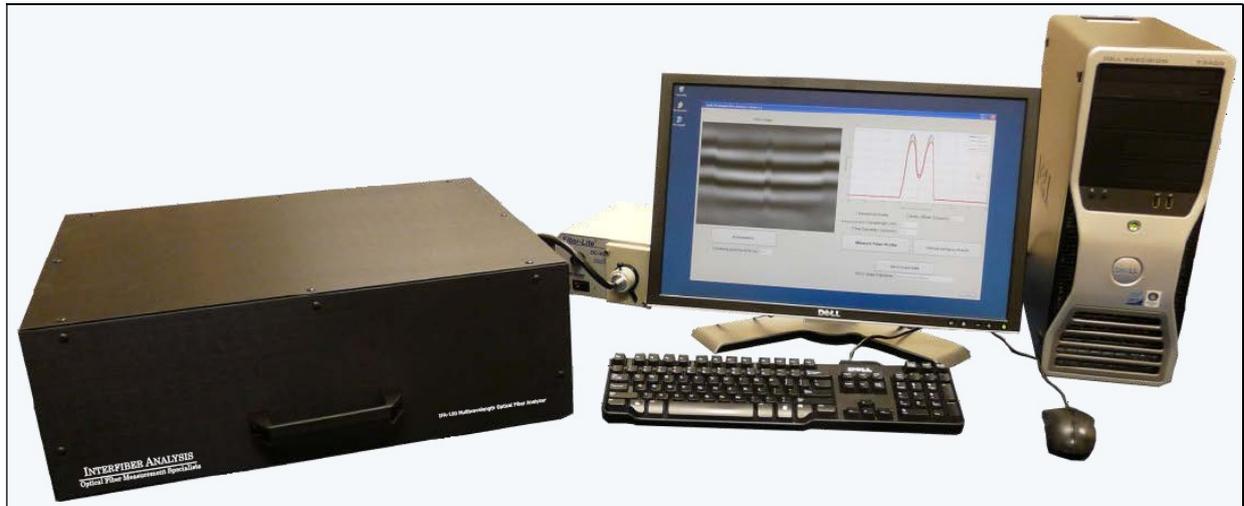
使用时无需旋转光纤或扫描光纤端面，并且测量速度非常快，这意味着 STAR-nPA-400 非常适用于生产线、研发实验室或 QA 环境。

特点和优势

- 秒测
- 非常快速和简单的光纤准备工作——只需切割和插入光纤
- 高度用户友好的软件
- 可测量直径高达 400 μm 的光纤
- 测量非圆形对称纤维——适用 PM；八角形，多核
- 可溯源校准



IFA-100光纤折射率分析仪

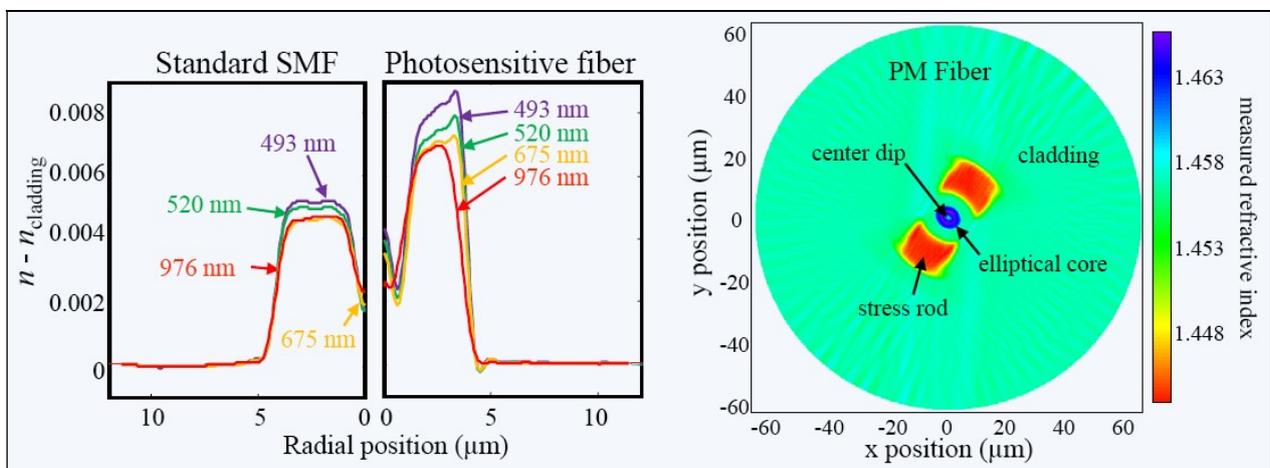


我们专注于横向干涉测量法，它是最敏感的光纤测量技术。

我们独家专利的多波长光纤折射率分析技术最早是在 OFC/NFOEC 2009 上发布的，并且此后一直成为同行业审查会议和期刊出版的主题。因为测量是横向执行（通过光纤的端口），所以它从本质上是无损检测。虽然光纤的高分子涂层或者缓冲区必须被去除，光纤本身仍然可以继续传输测量中的光信号，同时如果必要的话那些高分子涂层在光纤测量之后可以被完全恢复。

产品特点：

- 多波长
- 无劈开要求
- 亚微米空间分辨率
- 适用于任何形式光纤
- 快速测量
- 可测量接头、锥度、耦合器



技术参数:

折射率精度	+/- 0.0001
空间分辨率	~ 500 nm
测量波长	500 nm - 1 μ m
光纤直径	40 μ m - 400 μ m
光纤材质	硅玻璃, 非硅玻璃, 塑料
同轴度误差的测量	+/- 200 nm
同轴度误差的测量	+/- 0.4 %
光纤类型	单模, 多模, 微结构 (PCF), PM, 多芯, 稀土, 包层泵浦, 大模面积, 弯曲损失, 高- Δ , 等.